

財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心

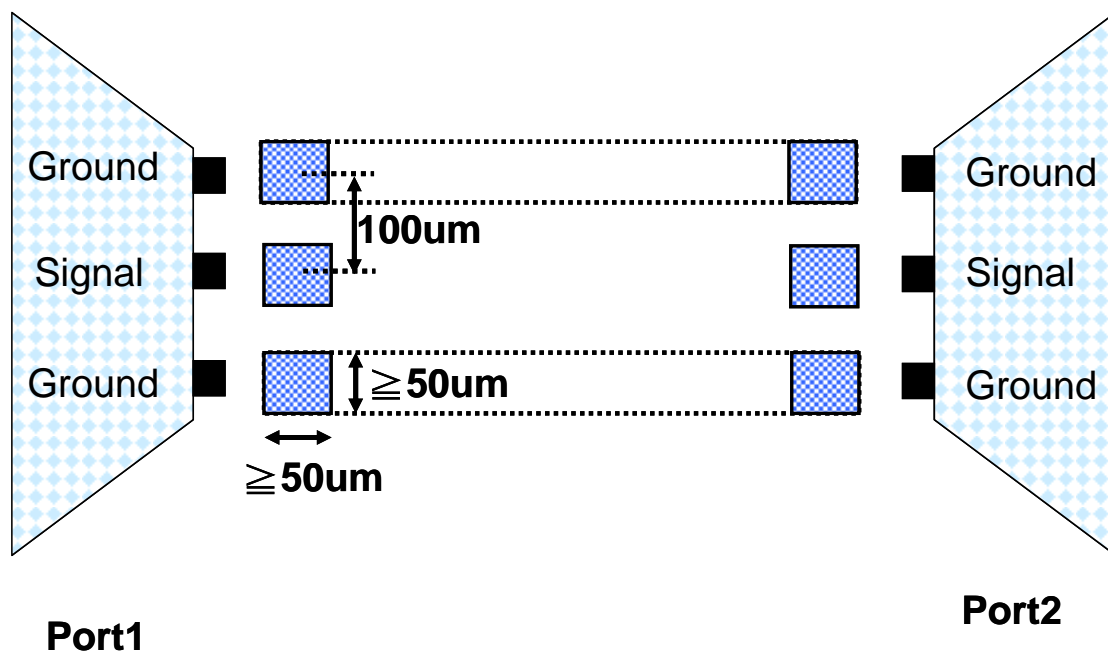
高頻元件量測型式與佈局規則

目前本中心僅提供 RF pitch 為 100um 的 single-ended (GSG) 探針。

1. On Wafer Measurement

- 單一 Pad 可允許之最小尺寸為 50um×50um。
- RF Single-ended 探針配置為 GSG。探針方向只能為東西向。
- 其它量測佈局型式，請事先與各系統負責工程師確認。

注意：若探針 pitch 不符合規則，需自行攜帶探針，請先聯絡各系統負責工程師，否則不予量測。110GHz 系統的 RF 探針無法自行攜帶。



探針座擺置示意圖

財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心

自備探針切結書

立書人(申請者)_____ (以下簡稱甲方)委託「財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心」(以下簡稱乙方)，進行高頻探針量測。

一、委託內容：

☐ On wafer Device and circuit measurement

☐ On wafer circuit measurement with PCB bias network

量測電路名稱: _____

二、甲方自行提供探針委託乙方進行量測，甲方完全了解過程中存在探針損傷的風險，甲方願意接受承擔此一風險，並放棄追究探針損傷相關的一切法律及賠償責任。

三、高頻探針之量測必須由本中心工作人員操作。

四、本切結書內容，如有虛偽不實情事，致使乙方遭受損害，甲方願負完全責任。

此致

財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心

立書人：(申請者)

服務機關：

姓 名：_____ (簽章)

地 址：_____

聯絡電話：_____

傳真號碼：_____

E - mail：_____

中 華 民 國 年 月 日